PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-212058

(43)Date of publication of application: 03.08.1992

(51)Int.Cl.

GO1N 30/48 B01J 20/10 B01J 20/22

(21)Application number: 03-045724

(71)Applicant:

KAGAKUHIN KENSA KYOKAI

(22)Date of filing:

18.02.1991

(72)Inventor:

SUDO YOSHIHISA TAKAHATA YASUYO

(30)Priority

Priority number: 02 43708

Priority date: 22.02.1990

Priority country: JP

(54) MANUFACTURE OF FILLING AGENT FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY

PURPOSE: To enable a filling agent for a liquid chromatography with less remaining silanol groups.

CONSTITUTION: A title item is provided with a process for performing chemical connection of an above chemical decoration agent to a silanol group on silica gel or a porous glass surface by allowing the chemical modification agent such as octadecylchlorosilane to react with the silica gel or the porous glass and a process for performing chemical connection of an above end cap to a remaining silane group on the silica gel or the porous glass surface by allowing the end cap agent to react with this chemically modified silica gel or the porous glass at a reaction temperature of 250° C or higher within a vapor.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

PEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号 特開平4-212058

(43)公開日 平成4年(1992)8月3日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

技術表示箇所

G 0 1 N 30/48

L 7621−2 J

B 0 1 J 20/10

D 8516-4G

20/22

D 8516-4G

審査請求 未請求 請求項の数4(全 11 頁)

(21)出願番号

特願平3-45724

(22)出願日

平成3年(1991)2月18日

(31)優先権主張番号 特顯平2-43708

(32)優先日

平 2 (1990) 2 月22日

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000173566

財団法人化学品検査協会

東京都墨田区東向島4丁目1番1号

(72)発明者 須藤 良久

埼玉県越谷市千間台東町8-22

(72)発明者 高畑 靖世

東京都豊島区北大塚1-5-11

(74)代理人 弁理士 小島 隆司

(54) 【発明の名称】 液体クロマトグラフイー用充填剤の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 残存シラノール基の少ない液体クロマトグラ フィー用充填剤を製造する。

【構成】 シリカゲル又は多孔質ガラスにオクタデシル クロロシラン等の化学修飾剤を反応させてシリカゲル又 は多孔質ガラス表面のシラノール基に上記化学修飾剤を 化学結合させる工程と、この化学修飾したシリカゲル又 は多孔質ガラスにエンドキャップ剤を気相中250℃以 上の反応温度で反応させてシリカゲル又は多孔質ガラス 表面の残存シラノール基に上記エンドキャップ剤を化学 結合させる工程とを具備する。

実施例4

【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリカゲル又は多孔質ガラスに化学修飾 剤を反応させて、シリカゲル又は多孔質ガラス表面のシ ラノール基に上記化学修飾剤を化学結合させる工程と、 この化学修飾したシリカゲル又は多孔質ガラスにエンド キャップ剤を気相中250℃以上の反応温度で反応させ て、シリカゲル又は多孔質ガラス表面の残存シラノール 基に上記エンドキャップ剤を化学結合させる工程とを具 備することを特徴とする液体クロマトグラフィー用充填 剤の製造方法。

【請求項2】 化学修飾剤としてジクロロシラン化合 物、トリクロロシラン化合物、ジアルコキシシラン化合 物、トリアルコキシシラン化合物、シクロシロキサン化 合物及びポリシロキサン化合物から選ばれる1種以上を 用いた請求項1記載の製造方法。

【請求項3】 エンドキャップ剤としてその1分子がシ リカゲル又は多孔質ガラスの2個以上の残存シラノール 基と反応する化合物を用いた請求項1又は2記載の製造 方法。

エンドキャップ剤としてその1分子がシ 20 【請求項4】 リカゲル又は多孔質ガラスの2個以上の残存シラノール 基と反応する化合物及びヘキサメチルジシラザンをそれ ぞれ用い、これらを順次化学修飾したシリカゲル又は多 孔質ガラスに反応させるようにした請求項1又は2記載 の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はシリカゲル又は多孔質ガ ラスにアルキル基等の化学修飾基を導入した液体クロマ トグラフィー用充填剤の製造方法に関し、更に詳述する 30 と、新規なエンドキャッピング法を用いた不活性な充填 剤の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来、 高速液体クロマトグラフィー用充填剤として、シリカゲ ルを各種の化学修飾基を有するシラン化合物でシリル化 することにより、シリカゲル表面のシラノール基に化学 修飾基を化学結合させたものが使用されている。なかで もオクタデシルクロロシラン化合物を用いてシリカゲル 表面にオクタデシル基を導入したオクタデシルシリカゲ ル充填剤(ODS)は広く使われている。また、その他 の化学修飾基としてはオクチル基、ブチル基、メチル 基、シアノプロピル基、フェニル基等が知られている。

【0003】この場合、上述した化学結合型シリカゲル 充填剤は、高速液体クロマトグラフィーの実施に際し、 基材のシリカゲル表面に存在する残存シラノール基の影 響が問題となっている。即ち、極性溶質、特に塩基性溶 質は残存シラノール基と強く相互作用し、このため塩基 性溶質が溶出しなかったり、溶出が遅れたり、ピークの

ムが得られないなどの問題がある。

【0004】これに対し、残存する未反応シラノール基 の影響を減少させる手段として、化学修飾基を結合させ たシリカゲルをトリメチルクロロシラン等によって再度 シリル化し、残存シラノール基に短鎖アルキル基を化学 結合させるエンドキャッピングが行なわれている。

2

【0005】この場合、従来のエンドキャッピングは、 トルエン等の溶媒中でシリカゲルを二次シリル化するこ とにより行なわれているが、このエンドキャッピングを 10 行なってもシラノール基はかなり残存し、ピークのテー リングが生じるものであった。

【0006】本発明は、上記事情に鑑みなされたもの で、新規なエンドキャッピング法を採用した残存シラノ ール基の影響が極めて少ない液体クロマトグラフィー用 充填剤の製造方法を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段及び作用】本発明者は、上 記目的を達成するために鋭意検討を行なった結果、エン ドキャッピングに際し、従来のように溶媒中で反応を行 なわずに、気相中において250℃以上の温度でシリカ ゲル又は多孔質ガラスとエンドキャップ剤との反応を行 なわせた場合、意外にも残存シラノール基の影響が非常 に少ない充填剤を合成できること見い出し、本発明をな すに至った。

【0008】従って、本発明は、シリカゲル又は多孔質 ガラスに化学修飾剤を反応させてシリカゲル又は多孔質 ガラス表面のシラノール基に上記化学修飾剤を化学結合 させる工程(以下第1工程という)と、この化学修飾し たシリカゲル又は多孔質ガラスにエンドキャップ剤を気 相中250℃以上の反応温度で反応させてシリカゲル又 は多孔質ガラス表面の残存シラノール基に上記エンドキ ャップ剤を化学結合させる工程(以下第2工程という) とを具備することを特徴とする液体クロマトグラフィー 用充填剤の製造方法を提供する。

【0009】以下、本発明につき更に詳しく説明する と、本発明においては、まず第1工程においてシリカゲ ル又は多孔質ガラスに化学修飾基を有する化学修飾剤を 反応させることによりシリカゲル又は多孔質ガラス表面 のシラノール基に上記化学修飾基を化学結合させる。

【0010】この場合、第1工程で用いるシリカゲルの 性状は特に制限されないが、粒子径1~1000μm、 より好ましくは2~50 µm、細孔径0~10000 A、より好ましくは60~1000A、比表面積1~1 $000m^2/g$ 、より好ましくは $10\sim600m^2/g$ の ものが好適に使用できる。なお、シリカゲルは、細孔径 0 Å、即ち、実質的に無細孔のものも使用し得る。

【0011】また、多孔質ガラスとしては、従来から液 体クロマトグラフィー用充填剤として使用されているい ずれのものも用いることができ、粒子径1~1000μ テーリング現象が起きたり、再現性の良いクロマトグラ $50~\mathrm{m}$ 、より好ましくは $2\sim5~0~\mathrm{\mu\,m}$ 、細孔径 $0\sim1~0~0~\mathrm{m}$

.3

0 Å、より好ましくは60~1000 Å、比表面積1~ $1000 \text{ m}^2/\text{g}$ 、より好ましくは $10\sim600 \text{ m}^2/\text{g}$ のものが好適に使用できる。なお、多孔質ガラスとして は、SiO280~99重量%、残部の主な成分がNa2 O, B₂O₃, A l₂O₃の1種又は2種以上であるものを 使用し得る。

【0012】化学修飾剤としては、従来から使用されて いるものを用いることができる。例示すると、オクタデ シル基、オクチル基、n-プチル基等の炭素数1~5 等の炭素数6~50、より好ましくは6~16のアリー ル基、更に炭素数1~50、より好ましくは1~18の アルキル基の水素原子の1又は2以上がシアノ基、水酸 基、カルポキシル基、酸アミド基、イミド基、スルホン*

*基、アミノ基、グリセロイル基又は加水分解によってこ れらの基に変換可能な基に置換されたアルキル基などを 化学修飾基として1~3個有するクロロシランやアルコ キシシラン又は上記化学修飾基を複数個、例えば6~1 00個有するシクロシロキサンやポリシロキサンが使用 される。なお、上記アルコキシシランのアルコキシ基と してはメトキシ基等の炭素数1~3の低級アルコキシ基 が好適である。また、シクロシロキサンとしてはケイ素 原子3~50が酸素原子を介してリングを形成したもの 0、より好ましくは $1\sim18$ のアルキル基、フェニル基 10 が好ましい。ポリシロキサンはケイ素原子を $2\sim50$ 有 するものが好ましい。このような化学修飾剤としては、 表1に示すものが具体的に挙げられる。

[0013]

【表1】

化学修飾基	化 学	侈	飾	剤
オクタデシル基	ジメチルオクタデシ/ シルメトキシシラン、 ン、メチルオクタデジルトリクロロシラン、 ン、1,3,5,7 - テトラオ ルシクロテトラシロコ	メチルオ: ハンジメト・ オクタデ クタデシ	クタデシ キシシラ シルトリ	ルジクロロシラ ン、オクタデ: メトキシシラ
フェニル基	トリフェニルクロロミラン、ジメチルフェニロロシラン、メチルコトリクロロシラン、ハーテトラフェニルートラシロキサン	-ルクロロ フェニルジ ベンジルト	シラン、 クロロシ リクロロ	ジフェニルジク ラン、フェニル シラン、1,3,5,
オクチル基	ジメチルオクチルクロ ロシラン、オクチル オクチルー 1,3,5,7 ー サン	・リクロロ	シラン、	1,3,5,7 - テトラ
nーブチル基	nープチルジメチルク クロロシラン、nーフ テトラーnープチルー ラシロキサン	チルトリ:	クロロシ	ラン、1,3,5,7 -
シアノブロピル基	3-シアノプロピルジ プロピルメチルクロロ クロロシラン			

【0014】上述した第1工程の化学修飾剤のうちで は、ジメチルオクタデシルクロロ (メトキシ) シラン等 のモノクロロシラン化合物やモノアルコキシシラン化合 ロシラン等のジクロロシラン化合物、オクタデシルトリ クロロシラン等のトリクロロシラン化合物、メチルオク タデシルジメトキシシラン等のジアルコキシシラン化合 物、オクタデシルトリメトキシシラン等のトリアルコキ シシラン化合物又は1,3,5,7-テトラオクタデシ ルー1, 3, 5, 7ーテトラメチルシクロテトラシロキ サン等のシクロシロキサン化合物、ポリシロキサン化合 物を用いることが好ましい。即ち、第2工程のエンドキ ャッピングにおいては、後述するように反応温度が高い

の反応の際に反応温度が高いほど既にシリカゲルに化学 結合されている化学修飾基の脱離が生じ易くなる。しか し、第1工程において化学修飾剤としてジもしくはトリ 物を用いることもできるが、メチルオクタデシルジクロ 40 クロロシラン化合物、ジもしくはトリアルコキシシラン 化合物又はシクロシロキサン化合物やポリシロキサン化 合物を用いることにより、上述したエンドキャッピング 時における化学修飾基の脱離を良好に防止できるもので あり、この脱離防止の効果はモノクロロあるいはモノア ルコキシシラン化合物よりも上記化合物を用いたときの 方が大きい。

【0015】上述したシリカゲル又は多孔質ガラスに対 する化学修飾剤の反応は公知の方法、条件を採用するこ とができ、例えばシリカゲル又は多孔質ガラスと化学修 ほど反応が進み、残存シラノール基が少なくなるが、こ 50 飾剤とを溶媒中で反応させることにより化学修飾を行な

うことができる。この場合、溶媒としてはトルエン等の 化学修飾剤と反応せずかつ反応温度において熱的に安定 なものを使用することができる。また、反応温度は通常 0~400℃の範囲であり、時間は30分~72時間の 節囲である。

【0016】本発明の第2工程では、第1工程で得た化 学修飾シリカゲル又は多孔質ガラスを溶媒を用いない気 相反応によってエンドキャップするものである。即ち、 第1工程で得た化学修飾シリカゲル又は多孔質ガラスに エンドキャップ剤を気相中において250℃以上の温度 10 で反応させ、残存シラノール基をエンドキャップする。

【0017】この場合、反応温度が250℃より低いと シラノール基の残存量が多くなる。また、温度の上限は 特に制限されないが、温度が高くなり過ぎると残存シラ ノール基は少なくなるが、既にシリカゲル又は多孔質ガ ラスに化学結合されている化学修飾基の脱離が多くなる 場合があるので、その上限は500℃とすることが好ま しい。なお、より好ましい反応温度は250~450 ℃、特に250~400℃である。また、反応時間は3*

R³

$$R^{3} \begin{array}{c|c} R^{1} & R^{1} \\ S_{i} - O & S_{i} - H \\ R^{2} & D & R^{2} \end{array} \qquad \cdots (2)$$

$$R^{9} = \begin{cases} R^{1} & R^{1} \\ S_{i} - O & S_{i} - OR^{4} \\ R^{2} & R^{2} \end{cases}$$
 ...(3)

(但し、式中R1, R2, R3, R1は炭素数1~9のアルキル基、より好ま しくは炭素数1~3のアルキル基を示す。nは0~50の整数、mは1~ 50の整数である。)

【0021】このようなエンドキャップ剤としては、例 えばヘキサメチルジシラザン、ペンタメチルジシロキサ ン、ジエチルメチルシラン、トリエチルシラン、トリメ チルメトキシシラン、ヘキサメチルジシラン等を好適に 用いることができる。

【0022】また、エンドキャップ剤としてはその1分 子が2個以上の残存シラノール基と反応する化合物(以 下橋かけ状エンドキャップ剤という)を好ましく用いる ことができ、これにより化学修飾基の周囲の複数の残存

*0分~96時間程度、より好ましくは12~48時間と することが望ましい。

【0018】反応雰囲気は、窒素、ヘリウム、アルゴン 等の不活性ガス雰囲気とすることが好ましい。また、エ ンドキャップ剤の導入量は、適宜選定され、特に限定さ れるものではないが、0.001~5ミリモル/m1、 特に 0. 01~1ミリモル/mlが通常である。なお、 エンドキャップ剤は250~420℃においてガス状の もの及び液状のものをそのまま導入できる。

【0019】本発明の第2工程で用いるエンドキャップ 剤の種類に制限はなく、種々のシラザン化合物、シラン 化合物、シロキサン化合物等を用いることができ、具体 的には、下記式(1)のジシラザン、式(2)のハイド ロジエンシラン、式(3)のアルコキシシラン、式 (4) のジシラン、式(5) のシロキサンを用いること ができる。

[0020]

【化1】

50 シラノール基にエンドキャップ剤が橋かけ状に化学結合

した構造を有し、残存シラノール基の影響が著しく少な い充填剤を得ることができる。このような橋かけ状エン ドキャップ剤としては、下記式(6)のシクロシロキサ ン、式(7)のハイドロジェンシロキサン、式(8)の* *アルコキシシラン、式(9)のシロキサンなどを用いる ことができる。

[0023]

[化2]



(但し、R1、R3は上記と同様の意味を示し、xは3~10の整数であ る。)

$$R^{7} = \begin{cases} R^{5} & R^{5} \\ S_{i} - O & S_{i} - R^{7} \\ R^{6} & R^{8} \end{cases}$$
 ...(7)

(但し、R⁶, R⁶, R⁷は水素原子又は炭素数1~9、より好ましくは1~ 3のアルキル基、mは上記と同様の意味を示すが、式 (7) 中のSiH基 は2個以上、より好ましくは2~3個である。)

(但し、R⁸, R⁹, R¹⁰は炭素数1~4のアルコキシ基又は炭素数1~ 9、より好ましくは $1\sim3$ のアルキル基、mは上記と同様の意味を示す が、式(7)中のケイ素原子に直結したアルコキシ基は2個以上、より好 ましくは2~3個である。)

$$R^{3} \xrightarrow{\begin{array}{c} R^{1} \\ Si-O \\ R^{2} \end{array}} \xrightarrow{\begin{array}{c} R^{1} \\ Si-R^{3} \end{array}} \cdots (9)$$

(但し、R1, R2, R3は上記と同様の意味を示し、yは1~100の整数 である。)

【0024】上記橋かけ状エンドキャップ剤として具体 的には、例えばヘキサメチルシクロトリシロキサン、オ ペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサ ン、1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3, 5, 5 - ヘキサメチルトリシロキサン、 1, 3-ジメトキシテトラメチルジシロキサン等が挙げ られるが、特にヘキサメチルシクロトリシロキサンが好 ましい。

【0025】更に、本発明の第2工程においては、一度 の反応によってエンドキャッピングを完了することもで きるが、2度以上のエンドキャップ反応を順次行なわせ ることができ、これにより残存シラノール基の影響をい 50 する吸着が少なく、従ってこの充填剤を充填したカラム

っそう減少させることができる。ここで、2度のエンド キャップ反応を順次行なう場合、1度目の反応のエンド クタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロ 40 キャップ剤としては上述した橋かけ状エンドキャップ 剤、特にヘキサメチルシクロトリシロキサンを用い、2 度目の反応のエンドキャップ剤としてはヘキサメチルジ シラザンを用いることが好適であり、これにより残存シ ラノール基の影響を著しく少なくすることができる。 [0026]

> 【発明の効果】以上説明したように、本発明の製造方法 は、エンドキャップに気相法を用いているのでシラノー ル残存量が少ない充填剤を得ることができる。この充填 剤はシラノール残存量が少ないため、塩基性化合物に対

は分析に際し塩基性化合物の不溶出や吸着、テーリングなどの不都合が少なく、正確な分析を行なうことができる。

[0027]

【実施例】次に、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限されるものではない。

【0028】まず、下記第1工程及び第2工程によって 液体クロマトグラフィー用充填剤を製造した。

[0029]

第1工程:シリカゲルの化学修飾

細孔径約100Å、平均粒子径約5 μ mの球形シリカゲルに化学修飾剤として表2、3に示すモノクロロシラン化合物、ジクロロシラン化合物又はトリクロロシラン化合物を反応させ、表面シラノール基にオクタデシル基、フェニル基、n-プチル基又は3-シアノプロピル基を化学結合させた。

【0030】この場合、上記シリカゲル10gを120*

*℃で6時間真空乾燥し、ナスフラスコ中で乾燥トルエン40ml、化学修飾剤20ミリM、化学修飾剤と当量のピリジンを加え、油浴中トルエン環流下で16時間反応させた。次に、グラスフィルター(G-4)を用いて濾過し、トルエン150mlで洗浄濾過した。その後、化学修飾剤にモノクロロシラン化合物を用いた場合は①の操作を行い、ジクロロシラン化合物及びトリクロロシラン化合物の場合は②の操作を行なった。① メタノール150ml、更にアセトン100mlで洗浄濾過後、120℃で6時間真空乾燥を行なった。② アセトニトリル100mlで洗浄濾過後、アセトニトリル:水(1:1)の混合液を加え、撹拌して未反応のクロル基を加水分解して、グラスフィルター(G-4)を用いて濾過し、メタノール100ml、更にアセトン100mlで洗浄濾過し、120℃で6時間真空乾燥を行なった。

10

[0031]

【表2】

実施例 グループ	実施例 No.	第11程の化学修飾剤
A	1~7	ジメチルオクタデシルモノクロロシラン
В	8~12	メチルオクタデシルジクロロシラン
С	13~26	オクタデシルトリクロロシラン
	27	ジメチルオクタデシルモノクロロシラン
D	28	メチルオクタデシルジクロロシラン
	29~31	オクタデシルトリクロロシラン
E	32	トリフェニルクロロシラン
	33	ジメチルフェニルクロロシラン
F	34	ジフェニルジクロロシラン
ļ ^r	35	メチルフェニルジクロロシラン
G	36	フェニルトリクロロシラン
н	37	ロープチルトリクロロシラン
П	38	3 - シアノプロトリクロロシラン

[0032]

第2工程:エンドキャッピング

第1工程で化学修飾したシリカゲル3gと表3,4に示すエンドキャッピングのためのシラン化合物2.9mM (グループA~Fの場合)又は4.4mM (グループG,Hの場合)とを密閉容器に入れ、容器内部を窒素で置換し密閉した。次に、これを恒温槽内において表3,4で示す温度で同表に示す時間加熱した後、これをグラスフィルターを用いてトルエンで洗浄濾過し、更にメタノールで洗浄濾過してから120℃で2時間直空乾燥を

行なった。

【0033】次に、得られた充填剤の元素分析及び残存シラノール基の影響の検討を下記方法で行なった。結果を表3,4に示す。

[0034]

元素分析

置換し密閉した。次に、これを恒温槽内において表3, 得られた充填剤の元素分析を行ない、炭素含有量の増減 4で示す温度で同表に示す時間加熱した後、これをグラ により、エンドキャッピング時における化学修飾基の脱 スフィルターを用いてトルエンで洗浄濾過し、更にメタ 離の程度を調べた。この場合、炭素含有量の減少量が小 ノールで洗浄濾過してから120℃で2時間真空乾燥を 50 さいほど化学修飾基の脱離が少ないと認められる。

[0035]

残存シラノール基の影響の検討

得られた充填剤を、内径4.6 mm、長さ15 c mのステンレススチール製カラムに充填し、移動相としてアセトニトリル/水(容量比30/70)、流速1分間に1 m1、UV検出器の波長254 n mの分析条件にてピリジン150 μ g/m1とフェノール1000 μ g/m1とを含む混合試料を3 μ 1注入し、クロマトグラムを得た。このクロマトグラムよりピリジンのテーリングファクター及びピリジンとフェノールとの分離係数 α を算出 * 10

*した。

【0036】この場合、残存シラノールの影響が小さいほど塩基物質であるピリジンはフェノールと比較して早く溶出するようになり、 α の値は大きくなる。またテーリングは小さくなり、テーリングファクターの値は小さくなる。ここで、テーリングファクターと分離係数 α は次のように定義される。

12

[0037]

【数1】

① テーリングファクター= $\frac{W_{0.00}}{2f}$ (図 1 参照)

但し、 Was: ピーク基線からピーク高さの1/20の高さにおけ

るピーク幅

f: Wassのうち、ピーク頂点から記録紙の横軸へおろした垂線の交点とピークの立ち上り側までの距離

但し、 k_1 'および k_2 'は溶質 1 及び溶質 2 の容量比であり、 k_2 '> k_1 'である。容量比k'は $k'=\frac{t_0-t_0}{t_0}$ で定義され、ここで t_0 は溶質の保持時間であり、 t_0 は移動相自身がカラムを通過するのに要する時間である。

[0038]

【表3】

実施例	第	2 I	程		炭索含	テーリン	分離
No.	エンドキャッピン	グ剤の種類	反応温度 ℃	反広時間 hr	有量の 変化%	グファク ター	係数
グループA							
1	ヘキサメチルシクロト	リシロキサン	250	24	+ 1.0	. –	- i
2	"		300	"	- 0.85	-	-
3	"		350	"	- 24.9	1.52	-
4	"		370	"	- 36.2	1.51	2.65
5	ヘキサメチルジ	シラザン	250	"	+ 2.0	1.85	3.48
6	"		300	"	- 8.4	1.85	3.43
7	"		350	"	- 23.7	1.67	3.14
グループB							
8	ヘキサメチルシクロト	リシロキサン	250	24	+ 1.3	1.93	-
9	"		300	"	+ 4.3	1.31	-
10	"		350	"	- 1.1	1.42	-
11	"		370	"	- 10.0	1,53	2,65
12	ヘキサメチルジ	シラザン	350	"	- 11.1	1.59	3.25
グループC							
13	ヘキサメチルシクロト	リシロキサン	250	24	+ 4.4		-
14	"		300	"	+ 6.9	1.27	-
15	"		350	"	+ 1.0	1.21	-
16	"		370	"	- 5.9	1.43	2.67
17	ヘキサメチルジ	シラザン	360	46	-1.8	2.31	2.69
18	オクタメチルシクロテ)	・ラシロキサン	360	"	- 4.7	1.73	-
19	1,1,3,3 テトラメチル	レジシロキサン	340	"	+ 5.4	2.08	- 1
20	"		360	"	+ 0.37	1.29	2.86
21	ペンタメチルジ	シロキサン	340	"	+ 1.6	1,68	-
22	ジエチルメチ	ルシラン	340	"	+ 3.6	1.40	-
23	"		360	"	+ 3.1	1.26	-
24	トリメチルメトニ	トシシラン	340	"	+1.2	1.63	-
25	ヘキサメチル	ジシラン	340	"	+ 2.0	1.63	-
26	<i>"</i>		360	"	- 3.8	1.32	

[0039]

【表4】

strte (2)		第	2	エ	程		炭素含	テーリン	分離
実施例 No.	エンド	キャッヒ	ング剤	の種類	反応基度 ℃	反応時間 hr	有量の 変化%	グファク ター	係数
グループD									
27	1回目	ヘキサメ シロキサ		クロトリ	350	24	- 33.3	1.35	3.65
	2回目	ヘキサメ	チルジ	シラザン	"	"			
28	1回目	ヘキサメ シロキサ	-	クロトリ	"	"	- 3.0	1.38	3.71
	2回目	ヘキサメ	チルジ	シラザン	"	"			
29	1回目	ヘキサメ シロキサ		クロトリ	"	"	+ 3.7	1.33	3.72
	2回目	ヘキサメ	チルジ	シラザン	"	"			
30	1回目	ヘキサメ シロキサ		クロトリ	340	42	+ 9.8	1.44	2.23
30	2回目		・チルシ /ロキサ	クロトリ ン	"	"	7 9.0	1.44	معت
31	1回目	ヘキサメ シロキサ	,	クロトリ	"	"	+ 2,4	1.12	2.96
	2回目	ジエチ	ルメチル	レシラン	"	"			
グループE	1								
32	ヘキサメ	チルシク	ロトリシ	ロキサン	350	24	- 31.9	2.21	2.46
33			,		"	"	- 24.9	2.01	2.53
グループド									
34	ヘキサメ	チルシク	ロトリシ	/ロキサン	350	24	+ 7.5	2.13	2.20
35		,	, ,		"	"	+ 9.5	1.88	2.34
グループG									
36	ヘキサメ	チルシク	ロトリシ	/ロキサン	340	24	+ 38.0	1.91	2.36
グループH									
37	ヘキサメ	・チルシク	ロトリミ	/ロキサン	340	24	+ 60.2	1.17	2.67
38		,	7		"	"	+ 59.5	1.61	2.98

【0040】ここで表の実施例グループA〜Hは下記の 基準で分類してある。

A:化学修飾剤としてオクタデシルモノクロロシラン化 合物を用いたもの

B:化学核飾剤としてオクタデシルジクロロシラン化合物を用いたもの

C:化学修飾剤としてオクタデシルトリクロロシラン化 合物を用いたもの

D:2度のエンドキャッピングを行なったもの

E:化学修飾剤としてフェニルモノクロロシラン化合物を用いたもの

F:化学修飾剤としてフェニルジクロロシラン化合物を*

*用いたもの

G:化学修飾剤としてフェニルトリクロロシラン化合物 を用いたもの

30 H:化学修飾剤として上記以外のトリクロロシラン化合物を用いたもの

また、上記実施例の充填剤の性能と市販の充填剤の性能とを比較するため、4種の代表的な市販ODSカラム(比較例 $1\sim4$)のピリジンのテーリングファクター及びピリジンとフェノールとの分離係数 α を調べた。結果を表5に示す。

[0041]

【表5】

	テーリング ファクター	分離係数α			
比較例1(D社製)	2.55	2.39			
比較例2(Y社製)	3.82	2.48			
比較例3(N社製)	3.09	1.53			
比較例4(S社製)	2.52	2.61			

【0042】更に、実施例4,11,16,29,36,37,38及び比較例1~4の充填剤を用い、液体クロマトグラフィーによってピリジン及びフェノールのクロマトグラムを得た。結果を図2~12に示す。

【0043】以上の結果より、下記(1)~(4)のことがわかる。

(1) 実施例のODS (グループA~D) は市販のOD 50 S (比較例1~4) に比べてピリジンとフェノールとの

分離係数αが大きく、ピリジンのテーリングファクターが小さかった。即ち、気相中において所定温度でエンドキャッピングを行なうことにより残存シラノール基の影響が非常に小さい充填剤を合成できた。

(2) ジクロロシラン化合物又はトリクロロシラン化合物によってシリカゲルを化学修飾した場合、モノクロロシラン化合物で化学修飾した場合に比べて気相中でのエンドキャッピング時におけるシリカゲルからの化学修飾基の脱離が少なく、より炭素含有率の高い充填剤を合成することができた。なお、残存シラノール基の影響の程 10度はいずれのクロロシラン化合物を用いた場合でも同程度であった。

(3) エンドキャッピングにヘキサメチルシクロトリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、テトラメチルジシロキサン等の2個以上のシラノール基と反応するシラン化合物を用いることにより、残存シラノール基の影響がいっそう少ない充填剤を合成できた。これは、これらのシラン化合物が修飾基周囲のシリカゲル表面において橋かけ状に化学結合し、効果的にシリカ表面を覆っているためであると考えられる。

(4) エンドキャッピング工程において最初にヘキサメチルシクロトリシランを用いてエンドキャッピングを行ない、次にヘキサメチルジシラザンを用いてエンドキャッピングを行なった場合、一度のエンドキャッピング処理に比べて残存シラノール基の影響が更に小さくなった。しかし、2度目のエンドキャッピングにヘキサメチルシクロトリシロキサン又はジエチルメチルシランを用いた場合にはあまり効果はなかった。

【図面の簡単な説明】

【図1】テーリングファクターの計算方法を示す説明図 30 である。

【図2】実施例4の充填剤を用いて液体クロマトグラフ

18 によりピリジンとフェノールを測定したときのクロマト[†] グラムである。

【図3】実施例11の充填剤を用いて液体クロマトグラフによりピリジンとフェノールを測定したときのクロマトグラムである。

【図4】実施例16の充填剤を用いて液体クロマトグラフによりピリジンとフェノールを測定したときのクロマトグラムである。

【図5】実施例29の充填剤を用いて液体クロマトグラ フによりピリジンとフェノールを測定したときのクロマ トグラムである。

【図6】実施例36の充填剤を用いて液体クロマトグラフによりピリジンとフェノールを測定したときのクロマトグラムである。

【図7】実施例37の充填剤を用いて液体クロマトグラフによりピリジンとフェノールを測定したときのクロマトグラムである。

【図8】実施例38の充填剤を用いて液体クロマトグラフによりピリジンとフェノールを測定したときのクロマトグラムである。

【図9】比較例1の充填剤を用いて液体クロマトグラフによりピリジンとフェノールを測定したときのクロマトグラムである。

【図10】比較例2の充填剤を用いて液体クロマトグラフによりピリジンとフェノールを測定したときのクロマトグラムである。

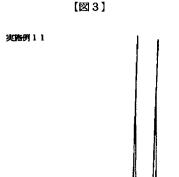
【図11】比較例3の充填剤を用いて液体クロマトグラフによりピリジンとフェノールを測定したときのクロマトグラムである。

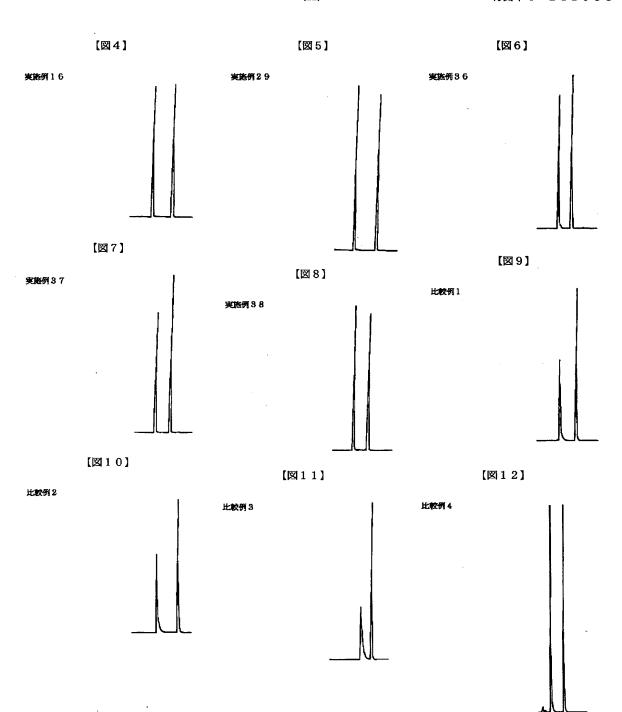
30 【図12】比較例4の充填剤を用いて液体クロマトグラフによりピリジンとフェノールを測定したときのクロマトグラムである。

【図1】 【図2】









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

PADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.